Synos

PMD002/IVL

IVL 測定モジュール

半導体レーザ素子の IVL 特性を簡単に測定。大面積 Si フォトダイオードを

IVL 測定モジュール PMD002/IVL は、半導体レーザや VCSEL 等発光素子の IVL 特性を簡単 に測定可能な測光モジュールです。小型軽量の IVL 測定センサヘッドは、単体での使用の他、 当社製高機能 NFP 計測光学系 M-Scope type S の対物レンズレボルバにも装着が可能です。 センサは 18mm 角大口径フォトダイオードを使用、広い放射角をカバーできます。

【製品の特長】

- ○18mm 角大型 Si フォトダイオードを使用。広い N.A. をカバー。
- ○減光フィルタの併用で広い測定パワーレンジ。
- ○当社製高機能 NFP 計測光学系 M-Scope type S の手動レボルバ部に装着が可能。
- ○プローバシステムへの装着と使用が可能。ウェハレベルで VCSEL の IVL 計測に対応可能。

【製品の主な仕様・機能】

大面積 SiPD 素子+SMU ○計測方式 ○計測波長域 PMD002/IVL VIS: 340nm~1000nm ○最大感度波長 λp 960nm ○受光感度 (λ=λp) 0.66W ○ワーキングディスタンス 約 10mm

 $\bigcirc N.A.$ ±30°(計測対象光束径約 10μmφ時)

○測定レンジ (at 940nm) (ND:無) $\sim 15 \text{mW}$

~95mW (ND: 10%) ~770mW (ND: 0.5%)

○減光方式 フィルタポートへの減光フィルタ挿入 方式(ヘッド入射部に1枚挿入可能)

* 赤外レーザ用 PMD002/IVL IR (900~1700nm 用は開発中)

【標準構成品】

○IVL 測定モジュール PMD002/IVL

●センサーヘッド 1式 ●減光フィルタ 2種類 (ND 10%、ND 0.5%) 各1個 ● IVL 測定ソフトウエア Optometrics IVL basic

【オプション】

- ○SMU(ソースメジャメントユニット
 - Keithley 製 2600 シリーズ(CW 測定)
 - Keithley 製 2520 (パルス測定)
 - *他のメーカ・機種の SMU に関してはご相談ください。

【ソフトウエアの機能】

IVL 測定ソフトウエア (機能)

○測定パラメータ

しきい電流 (Ith)・電圧 (Vth) 駆動電流 (If)·電圧 (Vf) 光出力 (Pf:Ifでの光出力)

スロープ効率 (SEf: If での傾き) 等

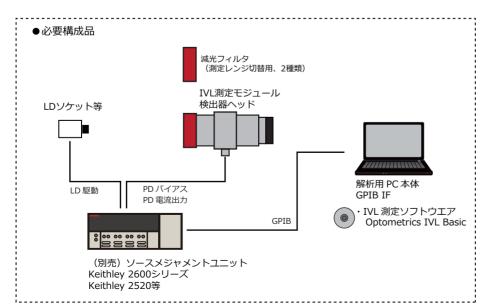


○機能

- ・グラフ表示機能
- · 計測条件設定機能
- ○データ保存
 - ・グラフデータ
 - ・グラフデータの csv 出力



○IVL 測定グラフ表示





【NFP&IVL 測定装置】 当社製高機能 NFP 計測光学系 M-Scope type S の手動レボルバに IVL 測定モジュール PMD002/IVLの検出器ヘッドを装着可能です。